

附表四

**電位導致衰減（PID）試驗**

	參考依據標準（應依產品類型採下列標準項目之一）
矽晶型	1. CNS 61215-1：2022、CNS 61215-1-1：2023、CNS 61215-2：2022 2. IEC 61215-1：2021、IEC 61215-1-1：2021、IEC 61215-2：2021
薄膜型	1. CNS 61215-1：2022、CNS 61215-1-4：2023、CNS 61215-2：2022 2. IEC 61215-1：2021、IEC 61215-1-2：2021、IEC 61215-1-3：2021、IEC 61215-1-4：2021、IEC 61215-2：2021

備註：以上標準所列年版或更新版

**鹽霧腐蝕試驗**

	參考依據標準（應採下列標準項目之一）
所有類型 模組產品	1. IEC 61701：2020 2. CNS 15196：2023

備註：以上標準所列年版或更新版